

卒業研究

高周波信号発生器の研究

群馬大学工学部電気電子工学科 通信処理システム第二研究室 学籍番号 99305023 大槻 純 指導教官 小林春夫 教授

Kobayashi Laboratory





問題設定 I,Q経路ミスマッチによるSFDR劣化 ダイナミックエレメントマッチングによる SFDR向上手法の提案 まとめ

Kobayashi Laboratory



問題設定

Kobayashi Laboratory



一理論計算、MATLAB/Simulinkによるシミュレーションを用いる。
 Kobayashi Laboratory Gunma University

送信機、任意波形発生器 のI,Q経路のミスマッチ

● 2ch DAC, ミキサー、LOを用いて ベースバンド信号を高周波信号に変調。 ● I, Q 経路ミスマッチによりミラー信号が 発生される。 SFDR劣化 ● I, Q 経路間のダイナミック・エレメント・ マッチング法によりミラー信号を周波数領域で 拡散する手法を提案。

Kobayashi Laboratory

信号発生器の周波数領域性能指標 SFDR(Spurious Free Dynamic Range)

創群馬大学



●性能指標としてEVM(Error Vector Magnitude)も用いられる。

Kobayashi Laboratory



I,Q経路ミスマッチによるSFDR劣化

Kobayashi Laboratory



ミスマッチがない場合



第二時大学 ミスマッチがない場合の出力スペクトル





ー段目のLOのゲインミスマッチ



ー段目のLOのゲインミスマッチの場合の出力 出力パワースペクトル



御辞馬大学 DACのゲイン,タイミング・ミスマッチ





出カパワースペクトル



の群馬大学 DACのゲイン,二次歪,三次歪・タイミング ミスマッチ

 $a_0 + a_1 \cos(\omega_0(t+dt)) + a_2 \cos^2(\omega_0(t+dt)) + a_3 \cos^3(\omega_0(t+dt))$



Kobayashi Laboratory





SFDRが大きく劣化

unma University



ダイナミック・エレメント・マッチング によるSFDR向上手法の提案

Kobayashi Laboratory

2ch DA変換器の入出力特性ミスマッチ

入力 X
→ DAC1
+ dt

$$y_1 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$$

入力 X
→ DAC2

$$t-dt$$
 $y_2 = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3$

オフセット
$$a_0 \neq b_0$$
 , ゲイン $a_1 \neq b_1$
二次歪 $a_2 \neq b_2$, 三次歪 $a_3 \neq b_3$
タイミングエラー $dt \neq 0$

Kobayashi Laboratory

2ch DAC に対しダイナミック・エレメン ト・マッチングを用いた回路の提案



Kobayashi Laboratory

2ch DAC に対しダイナミック・エレメン ト・マッチングを用いた回路の提案



Kobayashi Laboratory

の 群馬大学 DACのゲイン・タイミング・ミスマッチの場合 を用いる



Kobayashi Laboratory

Gunma University

sel



●1サイクル毎に切り換える場合



◆ 制御信号が1→Aの信号
 2→Bの信号

●擬似ランダムに切り換える場合



◆ ランダム信号の平均値0

分散1とした。

◆ スイッチでは0以上→Aの信号

0未満→Bの信号

Gunma University



出力パワースペクトル



Kobayashi Laboratory





Kobayashi Laborate



●DACのゲイン・タイミング・ミスマッチの場合 SFDR = 41.9dB

●1サイクル毎に切り換えるMUX SFDR = 40.0dB

●擬似ランダムで切り換えるMUX SFDR = 53.5dB

MUXを擬似ランダムに切り換えることでSFDRは 大きく向上

Gunma University





DACのゲイン,三次歪,タイミング・ミスマッチの場合 出力パワースペクトル



提案手法でSFDRが18.0dB向上

Gunma University

二次歪のミスマッチも加えた場合



Kobayashi Laboratory

二次歪のミスマッチも加えた場合

出力パワースペクトル



SFDRは改善しない

Kobayashi Laboratory



差動出力DAC

差動回路の場合

$$\begin{split} V_{sig} = V_{sig+} - V_{sig-} \\ \blacksquare \ensuremath{\mathbb{C}}\$$

$$V_{sig+} - V_{sig-} = 2a_1x + 2a_3x^3$$
 となる。

二次歪は差動構成でキャンセルされる。

三次歪が主要歪

Kobayashi Laboratory



まとめ

2ステップ構成の送信機・任意波形発生器で

- I, Q経路ミスマッチによるスプリアス発生を確認
- ダイナミックエレメントマッチングにより
- ✓ I, QDACのゲイン、三次歪、タイミングミスマッチに よりSFDR劣化が改善
- ✓ 二次歪の影響は改善できない

差動出力DACを用いれば二次歪なし

提案手法の有効性が示された

Kobayashi Laboratory



各パラメータの設定値

1~4までの測定において、 各値を次のように設定した。

$$f_{0} = \frac{\omega_{0}}{2\pi} \cong 10MHz \qquad a_{0} = 0.027 \qquad b_{0} = 0.033$$
$$a_{1} = 0.97 \qquad b_{1} = 1.03$$
$$f_{1} = \frac{\omega_{1}}{2\pi} \cong 1GHz \qquad a_{2} = 0.0273 \qquad b_{2} = 0.0327$$
$$f_{2} = \frac{\omega_{2}}{2\pi} \cong 4GHz \qquad a_{3} = 0.0276 \qquad b_{3} = 0.0324$$
$$dt = 100 pt$$
$$\Delta = 1\% \cong 0.01$$
$$A = 1$$

Kobayashi Laboratory